

量子效率测试系统 · QUANTUM EFFICIENCY

IRDT-QE

系列探测器量子效率测试系统

IRDT-QE Series Detector Quantum Efficiency (QE) Test System

适用于可见光、短波、中波波段探测器量子效率检测，精准输出完整量子效率光谱曲线。清晰表征器件光谱选择响应能力，直观体现芯片掺杂、缺陷等材料固有特性；同时兼容量子效率、相对光谱、光子转移等多项检测功能。



0.4~5.0 μm

光谱范围
SPECTRAL RANGE

1nm

光谱分辨率
RESOLUTION

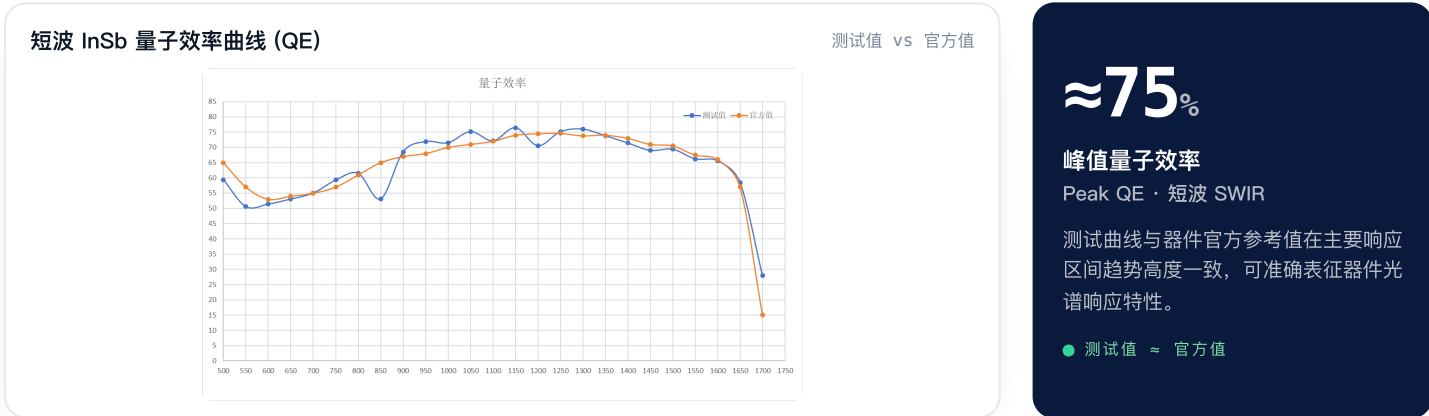
≤±5%

测试精度
TEST ACCURACY

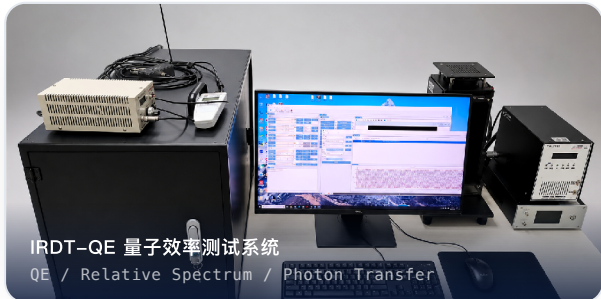
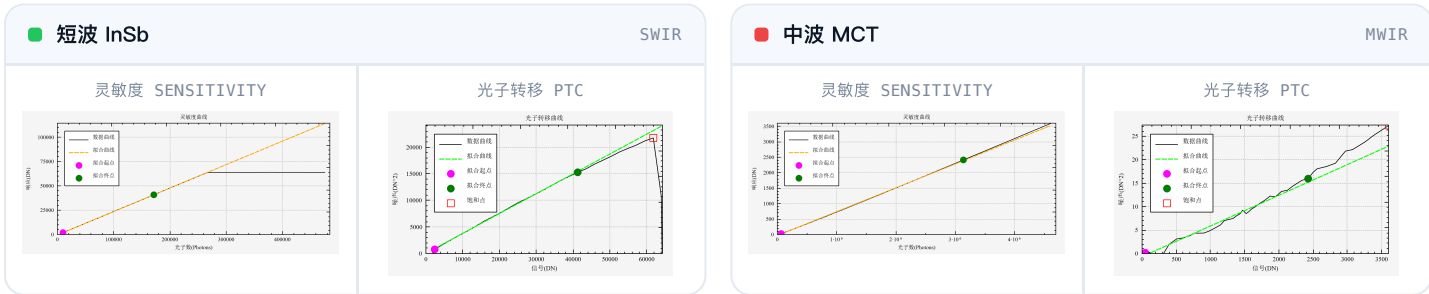
**核心光学器件
顶尖供应商**

高效率 · 高可靠
FIRST-TIER SUPPLIERS

核心测试能力 TEST OUTPUT · 量子效率光谱



灵敏度 & 光子转移曲线 SENSITIVITY & PHOTON TRANSFER · INSB / MCT



精准量子效率检测 · 一站式探测器表征

Precise QE measurement for IR detector characterization

WEB iescd.com
EMAIL sales@iescd.com
TEL 028-8437 8986